

【19】中華民國

【12】專利公報 (B)

【11】證書號數：I320895

【45】公告日：中華民國 99 (2010) 年 02 月 21 日

【51】Int. Cl.：

G06F17/10 (2006.01)

G11B11/00 (2006.01)

發明

全 5 頁

【54】名稱：專利品質及公司技術強度之評估方法及其儲存媒體物

QUALIFYING A PATENT AND A COMPANY TECHNICAL STRENGTH
METHOD AND MEDIUM THEREOF

【21】申請案號：094125332

【22】申請日：中華民國 94 (2005) 年 07 月 26 日

【111】公開編號：200705289

【43】公開日期：中華民國 96 (2007) 年 02 月 01 日

【72】發明人：陳達仁 (TW) CHEN, DAR ZEN；黃慕萱 (TW) HUANG, MUHSUAN

【71】申請人：國立政治大學

NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY

臺北市文山區指南路 2 段 64 號

【74】代理人：蔡坤財

[57]申請專利範圍

1. 一種專利品質評估方法，該方法係使用於一電腦系統中，其中該電腦系統包括一伺服器以及耦接該伺服器之一資料庫，包括：定義各引用人之對應權值，其中該對應權值根據各引用人於一產業中所擁有之市佔率來決定；以該資料庫所儲存一專利被該些引用人引用之次數以及該各引用人之對應權值，由該伺服器定義出該專利之引用人參數，其中該伺服器定義出該專利之引用人參數係使用下式計算： $f(\psi) = \prod \psi_{a,s}^{n_{a,s}}$ 其中 $\psi_{a,s}$ 為一引用人之對應權值， $n_{a,s}$ 為一引用人引用該專利之總次數；以該資料庫所儲存該專利核准後一特定時間內每年被引用之次數，由該伺服器定義出該專利之引用狀態參數，其中定義出該專利之引用狀態參數更包括：以所儲存該專利核准後一特定時間內每年被引用之次數，定義出一單次引用權值，其中單次引用權值係使用下式計算：

$$f(w) = \frac{E_{z,q}^{-1}}{\sum_{q=0} E_{z,q}^{-1}}$$

其中 $E_{z,q}$ 為該專利在 z 年被核准，而於第 $(z+q)$ 年被引用之次數；以該

專利每一年被引用次數以及每一年之單次引用權值定義出每一年總引用權值，其中每一年總引用權值係將該專利該年之單次引用權值乘上該專利該年之總引用次數；以及累加該特定時間內每一年之總引用權值以定義出該專利之該引用狀態參數，；以及該伺服器將該引用人參數乘上該引用狀態參數以定義出該專利之品質成績。

2. 如申請專利範圍第 1 項所述之方法，其中該專利每一年之之單次引用權值與該專利每年被引用之次數成反比關係。
3. 如申請專利範圍第 1 項所述之方法，更包括使用該伺服器定義一其他參數，其中該其他參數可為一專利之法律狀態品質、被引用層數品質、半衰期品質、被引用之分佈狀態品質或其上述組合，其中該專利之法律狀態參數，係指一專利存續期間其專利權利狀態受他人挑戰之情況；其中該專利之半衰期品質係指該專利之核准公開時間與引用該專利之一專利核准公開時間，兩者間之時間差。其中該專利之被引用之分佈狀態品質，係指該專利於公開後至到期前被引用之狀況。
4. 如申請專利範圍第 3 項所述之方法，更包括根據該引用人參數、該引用狀態參數以及該其他參數定義該專利之品質成績。

(2)

5. 如申請專利範圍第 4 項所述之方法，其中定義該專利之品質成績係指將該引用人參數、該引用狀態參數以及該其他參數相乘。
6. 一種專利品質評估方法，係用以評估一公司之專利品質，該公司於一技術領域中具有至少一篇專利，該方法係使用於一電腦系統中，其中該電腦系統包括一伺服器以及耦接該伺服器之一資料庫，包括：根據申請專利範圍第 1 項定義出該技術領域中各專利之引用人參數、引用狀態參數以及對應之品質成績；以該些品質成績，由該伺服器排序該些專利；定義一關鍵比例值，並將排序在該關鍵比例值內之專利定義為合於品質專利；該伺服器計算該公司合於品質之專利數；以及以該公司合於品質之專利數，由該伺服器定義該公司於該技術領域中之必要專利權值，其中該必要專利權值係使用下式計算：

$$EPI_{ij} = \frac{EPN_{ij} / P_{ij}}{X} \quad \text{其中 } EPN_{ij} \text{ 為該公司於該技術領域中合於品質專利數，} P_{ij} \text{ 則為公司}$$

於該技術領域中所擁有之總專利數。

7. 如申請專利範圍第 6 項所述之方法，更包括定義該技術領域中各專利之其他參數，其中該其他參數可為一專利之法律狀態品質、被引用層數品質、半衰期品質、被引用之分佈狀態品質或其上述組合，其中該專利之法律狀態參數，係指一專利存續期間其專利權利狀態受他人挑戰之情況；其中該專利之半衰期品質係指該專利之核准公開時間與引用該專利之一專利核准公開時間，兩者間之時間差。其中該專利之被引用之分佈狀態品質，係指該專利於公開後至到期前被引用之狀況。
8. 如申請專利範圍第 7 項所述之方法，更包括根據該引用人參數、該引用狀態參數以及該其他參數定義該專利之品質成績。
9. 如申請專利範圍第 8 項所述之方法，其中定義該專利之品質成績係指將該引用人參數、該引用狀態參數以及該其他參數相乘。
10. 如申請專利範圍第 6 項所述之方法，其中該關鍵比例值可為專利品質成績大於一定標準內之專利。
11. 一種評估一公司技術強度之方法，係用以評估一公司在該技術領域中所具有之技術強度，該方法係使用於一電腦系統中，其中該電腦系統包括一伺服器以及耦接該伺服器之一資料庫，包括：根據申請專利範圍第 10 項定義出該公司於該技術領域中之必要專利權值；計算該公司之現行衝擊指數值以及該公司於該技術領域中所擁有之總專利數；以及根據該必要專利權值、該現行衝擊指數值以及該總專利數定義出該公司之技術強度，其中定義該公司之技術強度係由下式計算： $ETS_{ij} = P_{ij} \times EPI_{ij} \times CII_{ij}$ 其中 ETS_{ij} 為該公司於該技術領域中之技術強度值， EPI_{ij} 為該公司於該技術領域中之必要專利權值， P_{ij} 為公司於該技術領域中所擁有之總專利數， CII_{ij} 為該公司於該技術領域中之現行衝擊指數值。
12. 一種電腦可使用媒體，其中儲存有一系列指令，當由一微處理器執行時，此微處理器可完成如請求項 1 所述之方法。
13. 如申請專利範圍第 12 項所述之媒體，更包括可執行下述程序：以品質成績排序專利；根據一關鍵比例值，定義合於品質專利；計算一公司合於品質之專利數；以及根據該合於品質之專利數定義該公司於一技術領域中之必要專利權值，其中定義該公司於該技術領域中之必要專利權值係由下式計算： $EPI_{ij} = \frac{EPN_{ij} / P_{ij}}{X}$ 其中 EPN_{ij} 為該公司合於品質之專利數， P_{ij} 則為公司於該技術領域中所擁有之總專利數。
14. 如申請專利範圍第 13 項所述之媒體，更包括可執行下述程序：計算該公司之現行衝擊指數值以及該公司於該技術領域中所擁有之總專利數；以及根據該必要專利權值、該現行

(3)

衝擊指數值以及該總專利數定義出該公司之技術強度，其中定義該公司之技術強度係由下式計算： $ETS_{ij}=P_{ij} \times EPI_{ij} \times CII_{ij}$ 其中 ETS_{ij} 為該公司於該技術領域中之技術強度值， EPI_{ij} 為該公司於該技術領域中之必要專利權值， P_{ij} 為公司於該技術領域中所擁有之總專利數， CII_{ij} 為該公司於該技術領域中之現行衝擊指數值。

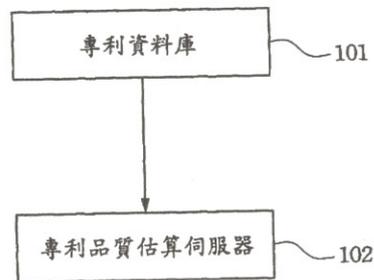
圖式簡單說明

第 1 圖所示為本發明評估一專利品質時所使用之系統方塊圖。

第 2 圖所示為專利單年之被引用次數分佈。

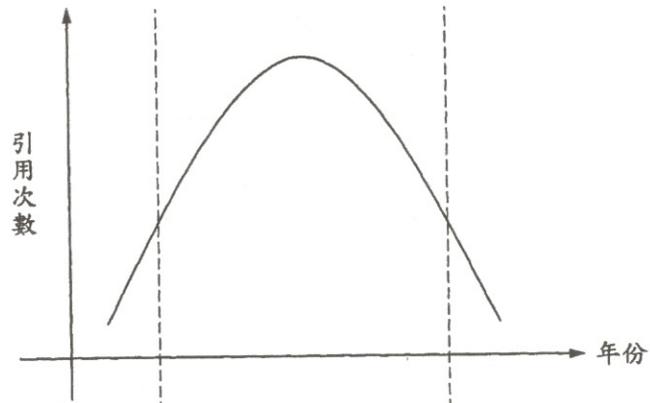
第 3 圖所示為專利核准公開後，被引用年與其專利重要性之關係圖。

第 4 圖所示為一專利被其他專利引用之階層關係圖。

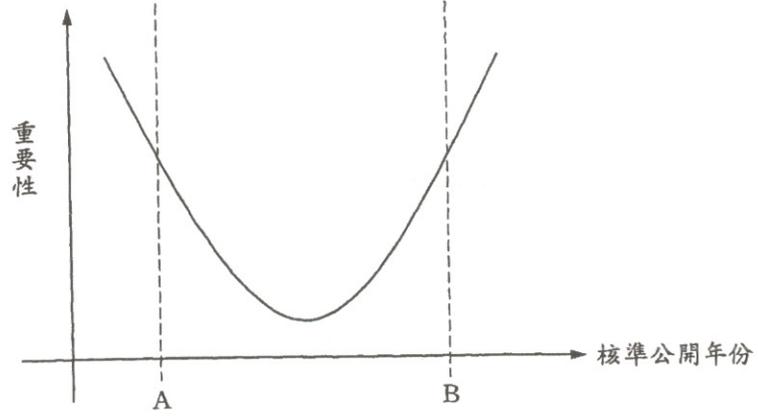


第 1 圖

(4)

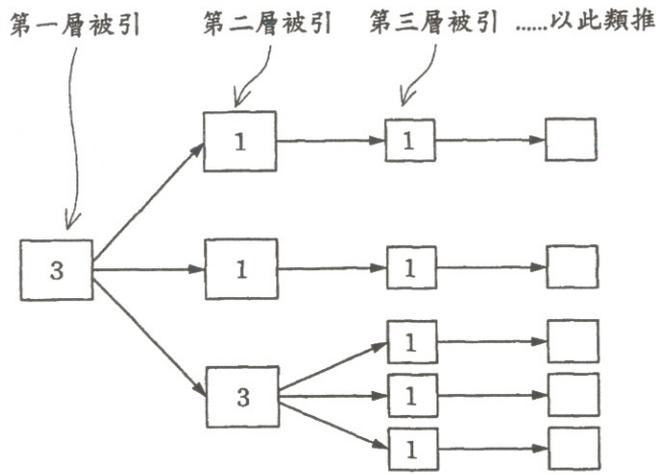


第 2 圖



第 3 圖

(5)



第 4 圖

【11】證書號數：I320895

【45】公告日：中華民國 99 (2010) 年 02 月 21 日

【51】Int. Cl. : G06F17/10 (2006.01) G11B11/00 (2006.01)

發明

全 5 頁

【54】名稱：專利品質及公司技術強度之評估方法及其儲存媒體物

QUALIFYING A PATENT AND A COMPANY TECHNICAL STRENGTH METHOD AND MEDIUM THEREOF

【21】申請案號：094125332

【22】申請日：中華民國 94 (2005) 年 07 月 26 日

【11】公開編號：200705289

【43】公開日期：中華民國 96 (2007) 年 02 月 01 日

【72】發明人：陳達仁 (TW) CHEN, DAR ZEN；黃慕萱 (TW) HUANG, MUHSUAN

【71】申請人：國立政治大學 NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY

臺北市文山區指南路 2 段 64 號

【74】代理人：蔡坤財

[57]申請專利範圍

1. 一種專利品質評估方法，該方法係使用於一電腦系統中，其中該電腦系統包括一伺服器以及耦接該伺服器之一資料庫，包括：定義各引用人之對應權值，其中該對應權值根據各引用人於一產業中所擁有之市佔率來決定；以該資料庫所儲存一專利被該些引用人引用之次數以及該各引用人之對應權值，由該伺服器定義出該專利之引用人參數，其中該伺服器定義出該專利之引用人參數係使用下式計算： $f(\psi) = \prod \psi_{a,s}^{n_{a,s}}$ 其中 $\psi_{a,s}$ 為一引用人之對應權值， $n_{a,s}$ 為一引用人引用該專利之總次數；以該資料庫所儲存該專利核准後一特定時間內每年被引用之次數，由該伺服器定義出該專利之引用狀態參數，其中定義出該專利之引用狀態參數更包括：以所儲存該專利核准後一特定時間內每年被引用之次數，定義出一單次引用權值，其中單次引用權值係使用下式計算：

$$f(w) = \frac{E_{z,q}^{-1}}{\sum_{q=0} E_{z,q}^{-1}} \text{ 其中 } E_{z,q} \text{ 為該專利在 } z \text{ 年被核准，而於第 } (z+q) \text{ 年被引用之次數；以該}$$

專利每一年被引用次數以及每一年之單次引用權值定義出每一年總引用權值，其中每一年總引用權值係將該專利該年之單次引用權值乘上該專利該年之總引用次數；以及累加該特定時間內每一年之總引用權值以定義出該專利之該引用狀態參數，；以及該伺服器將該引用人參數乘上該引用狀態參數以定義出該專利之品質成績。

2. 如申請專利範圍第 1 項所述之方法，其中該專利每一年之之單次引用權值與該專利每年被引用之次數成反比關係。
3. 如申請專利範圍第 1 項所述之方法，更包括使用該伺服器定義一其他參數，其中該其他參數可為一專利之法律狀態品質、被引用層數品質、半衰期品質、被引用之分佈狀態品質或其上述組合，其中該專利之法律狀態參數，係指一專利存續期間其專利權利狀態受他人挑戰之情況；其中該專利之半衰期品質係指該專利之核准公開時間與引用該專利之一專利核准公開時間，兩者間之時間差。其中該專利之被引用之分佈狀態品質，係指該專利於公開後至到期前被引用之狀況。
4. 如申請專利範圍第 3 項所述之方法，更包括根據該引用人參數、該引用狀態參數以及該其他參數定義該專利之品質成績。

(2)

5. 如申請專利範圍第 4 項所述之方法，其中定義該專利之品質成績係指將該引用人參數、該引用狀態參數以及該其他參數相乘。
6. 一種專利品質評估方法，係用以評估一公司之專利品質，該公司於一技術領域中具有至少一篇專利，該方法係使用於一電腦系統中，其中該電腦系統包括一伺服器以及耦接該伺服器之一資料庫，包括：根據申請專利範圍第 1 項定義出該技術領域中各專利之引用人參數、引用狀態參數以及對應之品質成績；以該些品質成績，由該伺服器排序該些專利；定義一關鍵比例值，並將排序在該關鍵比例值內之專利定義為合於品質專利；該伺服器計算該公司合於品質之專利數；以及以該公司合於品質之專利數，由該伺服器定義該公司於該技術領域中之必要專利權值，其中該必要專利權值係使用下式計算：

$$EPI_{ij} = \frac{EPN_{ij} / P_{ij}}{X} \quad \text{其中 } EPN_{ij} \text{ 為該公司於該技術領域中合於品質專利數， } P_{ij} \text{ 則為公司}$$

於該技術領域中所擁有之總專利數。

7. 如申請專利範圍第 6 項所述之方法，更包括定義該技術領域中各專利之其他參數，其中該其他參數可為一專利之法律狀態品質、被引用層數品質、半衰期品質、被引用之分佈狀態品質或其上述組合，其中該專利之法律狀態參數，係指一專利存續期間其專利權利狀態受他人挑戰之情況；其中該專利之半衰期品質係指該專利之核准公開時間與引用該專利之一專利核准公開時間，兩者間之時間差。其中該專利之被引用之分佈狀態品質，係指該專利於公開後至到期前被引用之狀況。
8. 如申請專利範圍第 7 項所述之方法，更包括根據該引用人參數、該引用狀態參數以及該其他參數定義該專利之品質成績。
9. 如申請專利範圍第 8 項所述之方法，其中定義該專利之品質成績係指將該引用人參數、該引用狀態參數以及該其他參數相乘。
10. 如申請專利範圍第 6 項所述之方法，其中該關鍵比例值可為專利品質成績大於一定標準內之專利。
11. 一種評估一公司技術強度之方法，係用以評估一公司在該技術領域中所具有之技術強度，該方法係使用於一電腦系統中，其中該電腦系統包括一伺服器以及耦接該伺服器之一資料庫，包括：根據申請專利範圍第 10 項定義出該公司於該技術領域中之必要專利權值；計算該公司之現行衝擊指數值以及該公司於該技術領域中所擁有之總專利數；以及根據該必要專利權值、該現行衝擊指數值以及該總專利數定義出該公司之技術強度，其中定義該公司之技術強度係由下式計算： $ETS_{ij} = P_{ij} \times EPI_{ij} \times CII_{ij}$ 其中 ETS_{ij} 為該公司於該技術領域中之技術強度值， EPI_{ij} 為該公司於該技術領域中之必要專利權值， P_{ij} 為公司於該技術領域中所擁有之總專利數， CII_{ij} 為該公司於該技術領域中之現行衝擊指數值。
12. 一種電腦可使用媒體，其中儲存有一系列指令，當由一微處理器執行時，此微處理器可完成如請求項 1 所述之方法。
13. 如申請專利範圍第 12 項所述之媒體，更包括可執行下述程序：以品質成績排序專利；根據一關鍵比例值，定義合於品質專利；計算一公司合於品質之專利數；以及根據該合於品質之專利數定義該公司於一技術領域中之必要專利權值，其中定義該公司於該技術領域中之必要專利權值係由下式計算： $EPI_{ij} = \frac{EPN_{ij} / P_{ij}}{X}$ 其中 EPN_{ij} 為該公司合於品質之專利數， P_{ij} 則為公司於該技術領域中所擁有之總專利數。
14. 如申請專利範圍第 13 項所述之媒體，更包括可執行下述程序：計算該公司之現行衝擊指數值以及該公司於該技術領域中所擁有之總專利數；以及根據該必要專利權值、該現行

(3)

衝擊指數值以及該總專利數定義出該公司之技術強度，其中定義該公司之技術強度係由下式計算： $ETS_{ij}=P_{ij}\times EPI_{ij}\times CII_{ij}$ 其中 ETS_{ij} 為該公司於該技術領域中之技術強度值， EPI_{ij} 為該公司於該技術領域中之必要專利權值， P_{ij} 為公司於該技術領域中所擁有之總專利數， CII_{ij} 為該公司於該技術領域中之現行衝擊指數值。

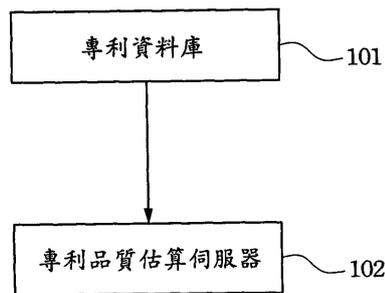
圖式簡單說明

第 1 圖所示為本發明評估一專利品質時所使用之系統方塊圖。

第 2 圖所示為專利單年之被引用次數分佈。

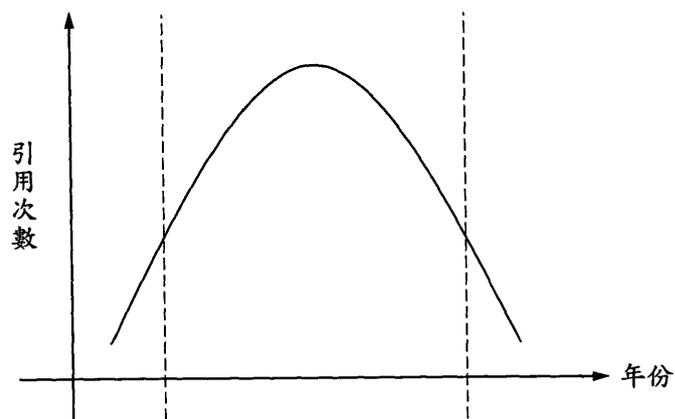
第 3 圖所示為專利核准公開後，被引用年與其專利重要性之關係圖。

第 4 圖所示為一專利被其他專利引用之階層關係圖。

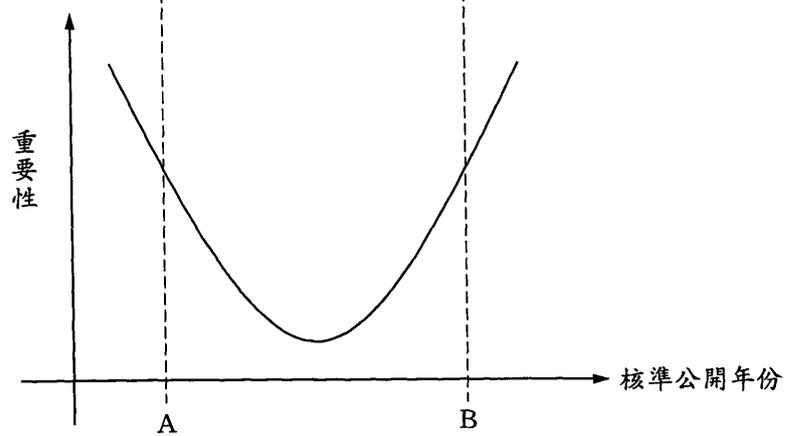


第 1 圖

(4)

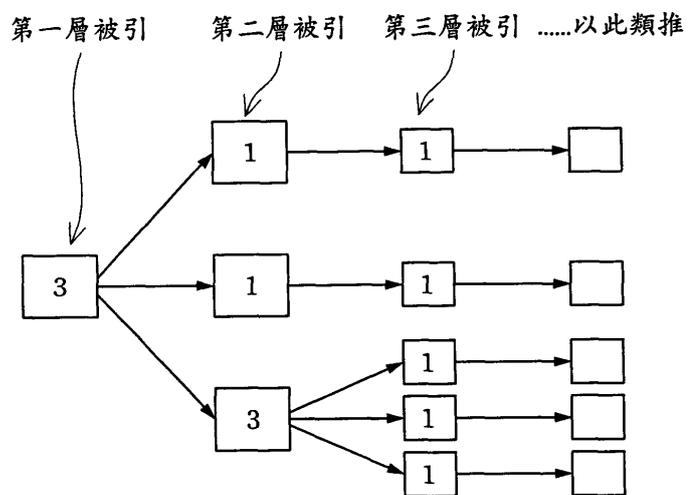


第 2 圖



第 3 圖

(5)



第 4 圖

